



NU-264 原子間力顕微鏡

パーク・システムズ社製 NX20

登録ファイル



スキャンファイル (.tiff) **※必須です**

AFM, MFM, KPFM, C-AFM等

構造化され、生データではない形となります

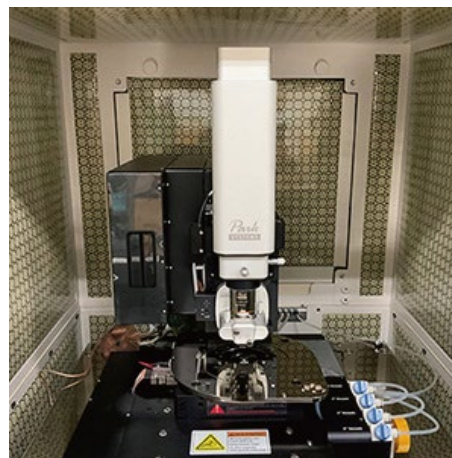
添付ファイル



AFM像、断面プロファイル、I-Vカーブ、
フォースカーブ等のテキストエクスポート
ファイル

必須ではありません

構造化されません



Z Heightのデータは XEIのFlatten機能で斜め補正を行ったものを登録してください。

(P2-3参照)

原則、実施日毎の登録をお願いします。

同日取得した同じ試料の画像であれば、AFM, MFMなど含め一緒に登録ファイルへ登録してください。

別の試料を使用した場合は、実施日が同日であっても一緒に登録をせず、別に登録いただくか、「連続登録」を行ってください。（連続登録：データ登録マニュアル[5/7]）

登録開始を押して構造化が始まると、**登録ファイルは追加・編集できません。**（追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください）



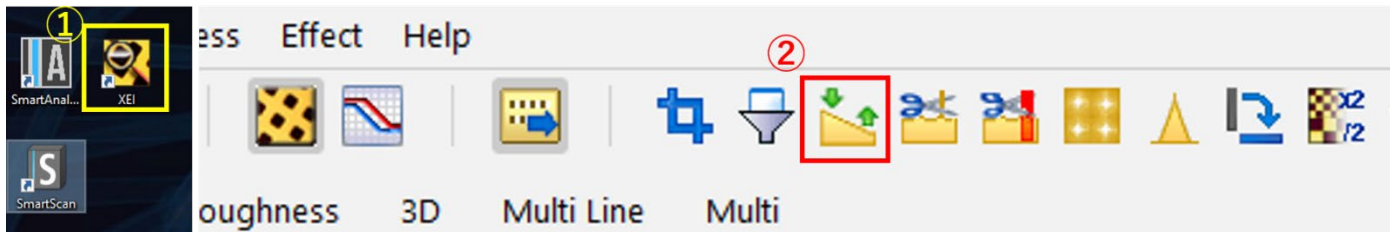
お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2026/6/1

XEI による斜め補正の手順

- ① Z Height のデータを XEI で開く
- ② Flatten のアイコンをクリック



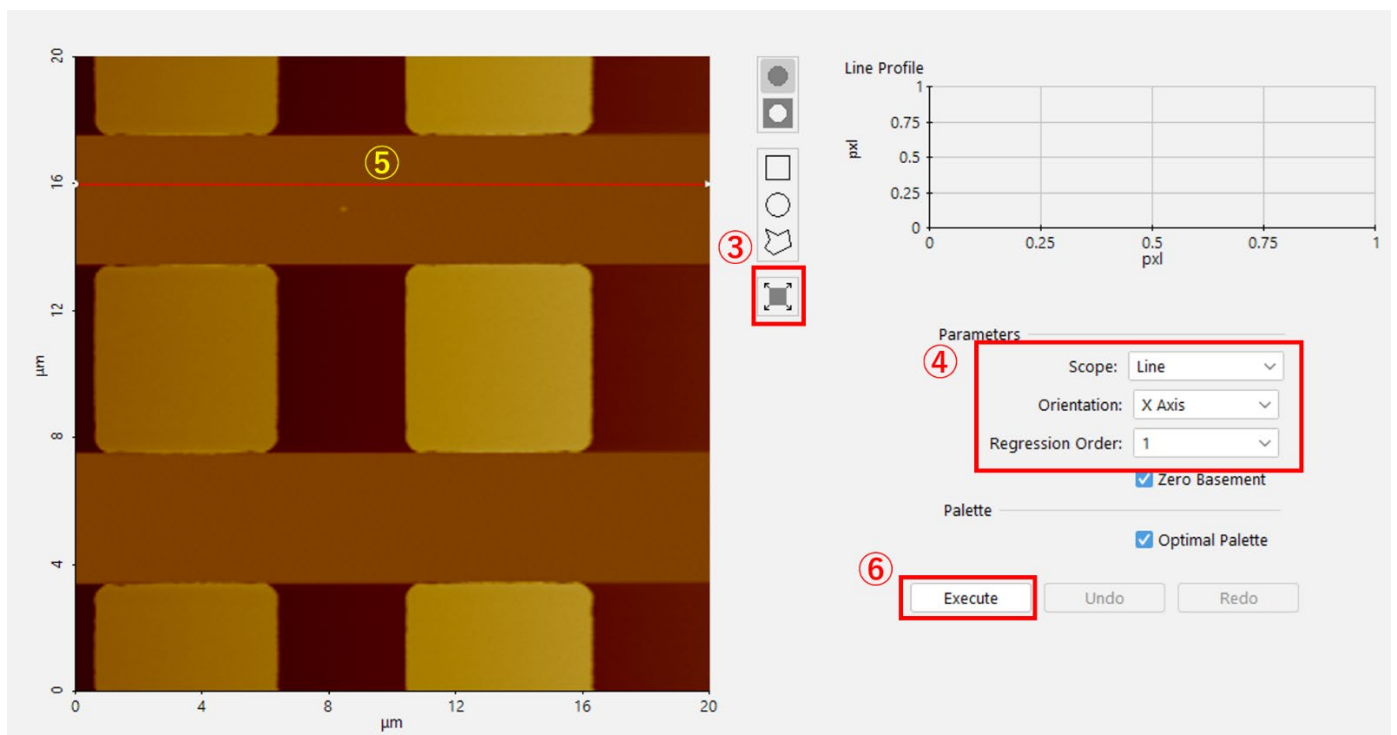
- ③ 画像全体を選択する
- ④ 基本的な斜め補正は次の設定で行う

Scope: Line

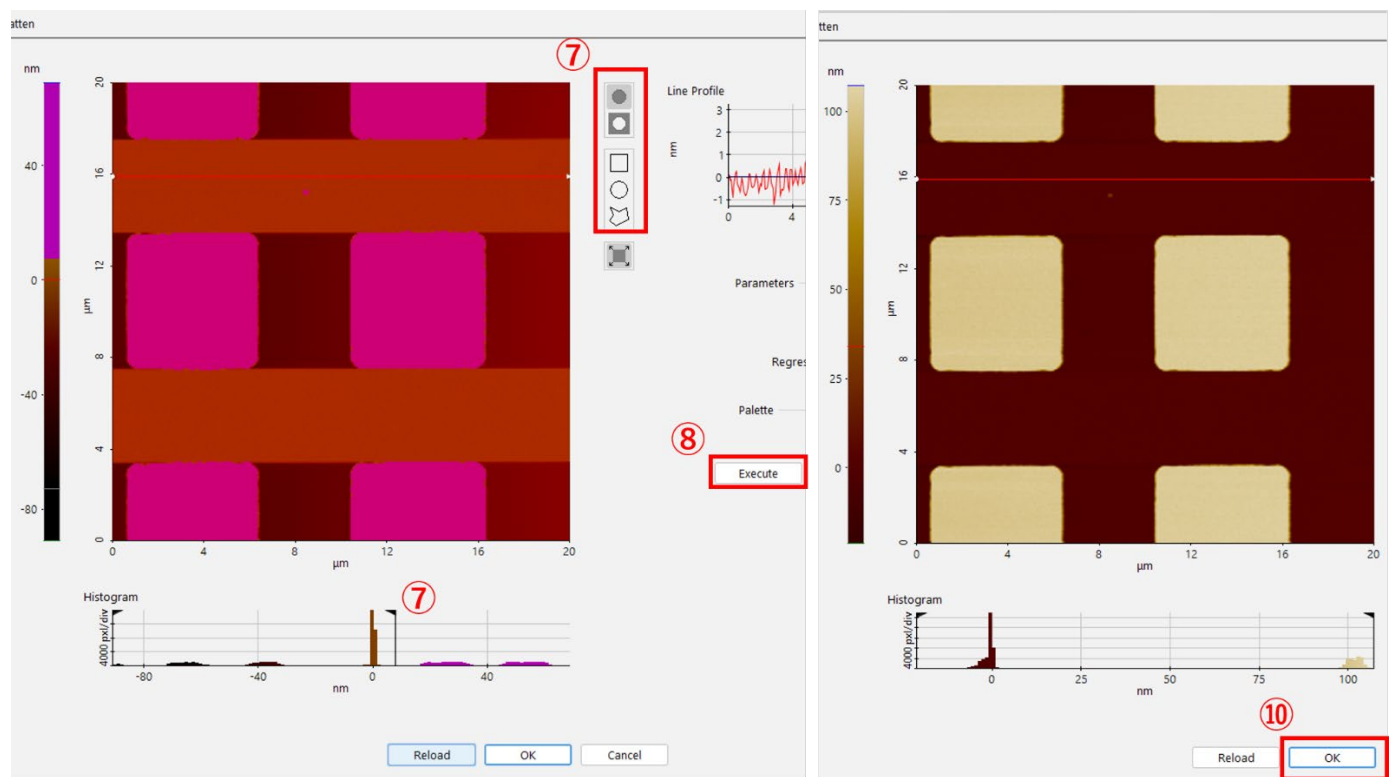
Orientation: XAxis

Regression Order: 1

- ⑤ 水平で凹凸の少ない Line を選択する
- ⑥ Execute をクリック



- ⑦ 大きな凹や凸な部分では補正が上手くいかず暗い線や明るい線が生じる
 そのような場合はヒストグラムや任意の図形で範囲を指定し凹凸部分を除外する
- ⑧ Execute をクリック
- ⑨ 画像がきれいに補正できるまで⑦⑧を繰り返す
- ⑩ 補正が完了したら OK をクリック



- ⑪ 生データを上書きしないように補正後のデータは Save as で生データの名前から変更して保存する